

測定計測展 実務応用セミナー 講演のご案内

測れるから、創れる未来がある。

測定計測展

— 進化する“ものづくり”の品質確保へ —



日時：2023年9月14日（木）
14：00～15：00

場所：東京ビックサイト 東4ホール
セミナー会場A

費用：無料（当日会場にて受付・要来場登録）

演題：Q I F が実現する
3 D A モデルによる品質保証
Q I F による3 D A 運用事例
（設計から品質保証まで）

講演：Mr. Daniel Campbell（CAPVIDIA）
・ Q I F ワーキンググループ議長
・ 米国 D M S C 理事会メンバー

中村 聡（Q V I ジャパン / 日本語解説）

国際規格 Q I F 形式の解説と、設計から
検査・品質保証における欧米での運用例を紹介

米国から Q I F ワーキンググループの議長が来日講演
（英語による講演・日本語解説付き）



来場登録フォーム
<https://www.expo-form.jp/united2023/entry.php?exh=1>

展示会の詳細は測定計測展のホームページ
（www.mt-expo.jp）をご確認ください。
会期中はM-20ブースにQ V I ジャパンのスタッフが
常駐し3 D A / M B D 関連のご質問をお受けします。